

2017

Elektronické součástky – Dlouhodobé skladování elektronických
polovodičových součástek –
Část 5: Čipové součástky a součástky
na křemíkové desce

ČSN
EN 62435-5

35 8793

idt IEC 62435-5:2017

Electronic components – Long-term storage of electronic semiconductor devices –
Part 5: Die and wafer devices

Composants électroniques – Stockage de longue durée des dispositifs électroniques
a semiconducteurs –
Partie 5: Dispositifs de puces et plaquettes

Elektronische Bauteile – Langzeitlagerung elektronischer Halbleiterbauelemente –
Teil 5: Chip- und Wafererzeugnisse

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62435-5:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62435-5:2017. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma je použitelná pro dlouhodobé skladování čipových součástek a součástek na křemíkové desce a stanoví režim a podmínky skladování pro jednotlivé holé čipy a částečné nebo kompletní čipy na křemíkové desce včetně čipů s přidanými strukturami jako jsou redistribuční vrstvy a kuličky pájky nebo jiná metalizace. Tato norma také poskytuje návod pro zvláštní požadavky a primární balení, které obsahují čipové součástky nebo součástky na křemíkové desce pro manipulační účely. Typicky se tato norma používá spolu s normou IEC 62435-1 pro dlouhodobé skladování součástek, jejichž doba skladování může být delší jak 12 měsíců u výrobků plánovaných pro dlouhodobé skladování.

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 62435-2 zavedena v ČSN EN 62435-5 (35 8793) Elektronické součástky – Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek – Část 2: Mechanismy zhoršování

Související ČSN

ČSN EN 60068-2-17 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky – Zkouška Q: Hermetičnost

ČSN EN 60068-2-20 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-20: Zkoušky – Zkouška T: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody

ČSN EN 60749-3 (35 8799) Polovodičové součástky – Mechanické a klimatické zkoušky – Část 3: Vnější vizuální kontrola

ČSN EN 60749-20-1 (35 8799) Polovodičové součástky – Mechanické a klimatické zkoušky – Část 20-1: Manipulace, balení, značení a přeprava povrchově montovaných součástek citlivých na společné působení vlhkosti a tepla při pájení

ČSN EN 60749-21 ed. 2 (35 8799) Polovodičové součástky – Mechanické a klimatické zkoušky – Část 21: Pájitelnost

ČSN EN 60749-22 (35 8799) Polovodičové součástky – Mechanické a klimatické zkoušky – Část 22: Pevnost spoje

ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 (34 6440) Elektrostatika – Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Obecné požadavky

ČSN CLC/TR 61340-5-2 (34 6440) Elektrostatika – Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Uživatelský návod

ČSN EN 62435-1 (35 8793) Elektronické součástky – Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek – Část 1: Obecně

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v člancích „Informace

o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.